Se	~	ah	A	-	-
.50	ar	cn	IV	o i	25



Appli	cation	Contro	l No.
-------	--------	--------	-------

09/461,336 Examiner

Asfand M. Sheikh

Applicant(s)/Patent under Reexamination CHEN ET AL. Art Unit

3627

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
705	37	. 1/18/2007	. AMS	
		-	<b></b>	

ΙΝΊ	INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
		<u></u>		

SEARCH N (INCLUDING SEARC			
		DATE	EXMR
EAST (see attached)		1/18/2007	AMS
	•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	